

Themen

Seminar Neue Technologien (SS 2009)

Name, Vorname	Thema
Leunde, Leticia	Code Coverage ohne Instrumentierung
Sdun, Frederik	C-Idiome
Glaser, Stefan	Modellbasiertes Testen ohne UML
Schindler, Ingo	Modellbasiertes Testen mit UML
Ivanova, Yuliya	JTAG basierte White-Box-Tests
Maier, Simon	Fuzzy-Regelungen auf Embedded Systems: Vor- und Nachteile
Sawin, Eugen	IEC 61508 konforme Testfallerstellung nach SIL 3
Johannes, Maximilian	Echtzeitprogrammierung mit Multicore-Prozessoren
Vetter, Annette	Safety Critical Design Pattern
Zaworski, Martin	Rekonfigurierbare Embedded Systems
Jens Cornelis	XUnit Test Pattern - Klassifizierung und Einsatz!
Becker, Paul	Metrikenbasierte Code-Reviews
Cornelis, Jens	XUnit Test Pattern - Klassifizierung und Einsatz

Prof. Dr.-Ing. D. Fischer / 21.3.2009